## 科学研究費助成事業

研究成果報告書



平成 26 年 6月 9日現在

機関番号: 1 2 4 0 1			
研究種目:基盤研究(C)			
研究期間: 2011~2013			
課題番号: 2 3 5 6 0 8 2 8			
研究課題名(和文)収束イオンビームを用いたナノワイヤー熱電変換素子へのナノ電極形成・輸送特性の解明			
研究課題名(英文)Study of transport property for thermoelectric nanowire using nano-processing			
研究代表者			
長谷川 靖洋(HASEGAWA, Yasuhiro)			
埼玉大学・理工学研究科・准教授			
研究者番号:60334158			
交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 3,900,000 円 、(間接経費) 1,170,000 円			

研究成果の概要(和文):高圧圧入法を用いて長さ1mm以上の単結晶Biナノワイヤー熱電変換素子の開発を行った。収 束イオンビームのナノ加工とその場電極形成により、ワイヤー直径4µm,700nmのワイヤー両側面に局所電極の形成 に成功した。これによって、4端子抵抗測定ならびにホール測定を行うことが出来た。抵抗測定から、ナノワイヤーの 抵抗が数k であったとしても、電極とワイヤー間との接触抵抗が無視できないことが明らかになった。ホール測定か ら、電子・ホールの各移動度の温度依存性を実験的に明らかにした。その結果、低温領域での抵抗率の上昇は、キャリ アの平均自由行程の制限によるものであると結論づけられた。

研究成果の概要(英文): We have fabricated single-crystal bismuth nano-wire possessing less than 1 micro-m and 1 mm-length. local electrodes were formed on side surface of the nano-wire by using nano-processing. As a result, Hall measurement for 4 micro- and 700 nm-diameter have been performed and obtained the mobili ty for each carrier from 4.2 to 300K. And it revealed that the the magnitude of the mobility in low temper ature region was saturated by limitation of the mean free path of the carrier and the temperature coeffici ent of the resistivity was changed from positive to negative, especially narrow wire.

研究分野:工学

科研費の分科・細目: 材料工学・構造・機能材料

キーワード:ナノ加工 ナノワイヤー ホール測定

## 1.研究開始当初の背景

熱電変換素子は、熱(温度差)から電気 へと直接エネルギー変換可能な素子であり、 その性能は熱電パラメータと呼ばれるゼー ベック係数 [V/K],抵抗率 [ m],熱伝 導率 [W/mK]の3つの物性値を使った性能 指数 Z= <sup>2</sup>/( ) [K<sup>-1</sup>]で表すことができ る。さらに絶対温度 T[K]をかけた無次元性 能指数 ZT を用いて、熱電変換素子のエネル ギー変換効率が見積もられている。しかし ながら、そのエネルギー変換効率が低いた め、さらなる性能向上が望まれている。熱 電変換素子の構造を変える,超格子,ナノ ワイヤーなどの材料に量子閉じ込めの概念 を導入することによって、状態密度の変化 に伴うゼーベック係数の上昇,散乱プロセ スの変化による抵抗率の減少,フォノン散 乱促進による熱伝導率の低下が期待でき、 無次元性能指数 ZT を現状の ZT~1から大 幅に引き上げることが出来るという理論的 な結論が導かれている(Hicks, Phys. Rev. B, 47,12727(1993))。事実、2 次元系材料 である超格子薄膜を用いて、ZT>2 という 実験結果が報告されており (Venkatasubramanian, Nature, 413, 597 (2001); Harman, Science, 297,2229 (2002))、量子閉じ込めを利用した熱電変換 素子は、ZT を大幅に向上させることのでき る有用な方法であることが既に広く認識さ れており、申請者は1次元材料として期待 できるナノワイヤー熱電変換素子の開発を 進めている

2.研究の目的

ゼーベック係数・抵抗率測定などを受け てナノワイヤー熱電変換素子の開発・評価 は大きく加速したものの、キャリア密度・ 移動度などの基本的な物性測定は未だにな されていない。通常のバルク材料であれば サンプル両側にホール電極を接合し、ホー ル測定を行うことによってキャリア密度・ 移動度を見積もることができるが、ワイヤ ー直径が小さいが故に、その側部に局所的 な電極接合が困難である。過去に Bi ナノワ イヤー側部に収束イオンビーム(FIB)を使 って電極を取り付けるという試みが行われ たが(S. B. Cornin et al, Nanotechnology, 13, 653 (2002))、1)観察のためワイヤー全 体に Ga イオンビームが照射されてしまう ために Bi ナノワイヤー中に Ga の不純物が 混入する,2)ナノワイヤー単体ではその表 面が酸化膜で覆われてしまうため、局所的 なオーミック電極接合が非常に困難である などの理由により、ナノワイヤー熱電変換 素子のホール測定は世界中で未だに成功に 至っていない。

我々の開発しているナノワイヤー熱電変 換素子は、素子全体が石英ガラスで覆われ ており、研磨と収束イオンビーム加工によ ってワイヤー側部のガラスを局所的に除去 し、その場電極蒸着を使ってホール電極を 取り付けることが可能となる。そして、ホ ール測定を行うことによって Bi ナノワイ ヤー熱電変換素子のキャリア密度・移動度 を決定することを目的とした。

## 3.研究の方法

これまでに作製されてきたナノワイヤー 熱電変換素子の例を示す。

全体の光学顕微鏡写真	端部の電子	ワイヤー
Biナノワイヤー	銀佩鏡与具	▲ 端部
石英ガラステンプレート	ダスト ―→	
1mm 長さ:1.64mm	500nm ←──→	直径:593nm

図1:直径 593nm のナノワイヤー熱電変換 素子の例

図1からも分かるように、本研究における ナノワイヤー熱電変換素子においては、長 さが1mm以上あることから、比較的簡便に 物性測定が可能となる。事実、ナノワイヤ ー熱電変換素子のゼーベック係数と抵抗率 の同時測定を行ったのは本研究グループで ある。一見、成功裡と考えられる素子の性 能評価においても、ワイヤー直径が小さく なると問題が明らかになってくる。つまり、 ナノワイヤー熱電変換素子の開発に大きな 役割を担っている石英ガラスが、物性測定 時には大きな障害と成りうる。ワイヤー長 さを1mmとした時、ワイヤー直径が小さく なると、ワイヤー自身が持つインピーダン スが数 M となり、通常の測定装置では対 応できない,もしくは測定時の時定数が大 きくなりすぎて、精密な測定が出来なくな る。一般的にはワイヤー途中に電極を取り 付けた4端子法を用いて、測定部分のイン ピーダンスが現実的な大きさ(例えば数k

)になるように制御するのであるが、石 英ガラスで覆われているため、ワイヤー途 中に電極形成が困難となっている。このた め、本研究の一環として、集束イオンビー ムを用いたナノ加工を用いて、一見不可能 と思われる電極形成を可能とした。

一般的な集束イオンビームは、加速した Ga イオンを用いるが、Bi 上へ Ga イオンが 照射されると、Bi は昇華するため、いかに ダメージを与えることなく電極形成をする かが問題となった。まず、直径 1mm程度 の石英ガラスを Bi ワイヤー表面と石英ガ ラス表面の距離が1µm程度になるように 手作業による研磨にする。ここで、両者の 距離を明確にするために、レーザー顕微鏡 を用いた。その後、ガラス表面に銅電極を 蒸着し、集束イオンビームによって全体を 5分割する。さらにワイヤーがあると考え られる領域に、集束イオンビームで少しず つ掘り進める。Ga イオンが高エネルギーで あること,ガラスが比較的軽元素から出来 ていることによって、ガラス表面と Bi ワイ ヤー表面の間が 50nm 程度以下になると、二 次電子放出率の違いによってワイヤーが石 英ガラス内にあったとしても、二次電子画 像によってワイヤーの位置が特定できる。 これによってイオンビーム量を絞りゆっく りと石英ガラスをスパッタリングすること によって、最低限のダメージでナノワイヤ ーを露出させることが可能となる(図2)。





図 2:集束イオンビームによる石英ガラス 中に Bi ワイヤー場所の同定法

その直後に、電子ビームを利用してその場 電極形成を行う。ガラス表面上に成膜され ているどう薄膜状にさらに電極をつなげる ことによってマクロに利用できる4端子法 に利用できる電極とすることが可能となる。

複数本の電極を取り付けることによっ て、さまざまな組み合わせで2,4端子 法を行うことによって、測定結果の信憑 性を確認することが可能となる。



図3:ホール測定用電極配位

初めての実験ではワイヤー直径 521nmの ものを用いている。上部から Ga イオンビ ームで石英ガラスを 10nm ずつ除去(スラ イス)しながら、同時に電子顕微鏡で観 察する方法を採用した。ナノワイヤー熱 電変換素子の側面が露出した瞬間に Ga イオンビームの照射を止め、すぐにその 場カーボン電極を蒸着する。当初、カー ボン電極で上部の銅電極に電気接続を行 ったのであるが、カーボン電極の抵抗値 が大きすぎて良好な電気接続が出来てい なかった。このため、ヘキサカルボニル タングステン(W(CO)₀)と Ga イオンビー ムとの反応を利用して、タングステンの 局所その場蒸着を利用して、銅電極まで の電気接続を行った。もちろん、全てタ ングステン蒸着が理想的であったが、装 置の制約上、カーボンとタングステン電

極を使い分けている。

4.研究成果

電極位置としては図4に示すような位 置関係で、合計8箇所(A,B:ナノワイヤ 一端部,1~6:ワイヤー側面)に金線に よる電極接合を行ったが、2箇所の電極 の不良が確認されたものの、残りの6箇 所は良好な接続が得られた。



図 4:ナノ加工後の各温度での I-V 特性

以上のナノ加工技術開発後、直径 700nmの Bi ナノワイヤーを用いて、ホール測定を行っ た。300K でのホール係数測定例と、移動度の 温度依存性を図 5 に示す。



図5:移動度の温度依存性

この結果からも分かるように、ワイヤー直 径が小さくなると、3次元形状であるバルク 素子とは異なる依存性を示し、特に低温領域 で移動度が小さくなる結果が得られた。

これまでにモデル計算にて、移動度がワイ ヤー境界散乱によって制限されると予想さ れてきたが、本研究によって実験を用いてこ のモデルを実証することが出来た。

## 5.主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔雑誌論文〕(計6件)

- Masayuki Murata, <u>Yasuhiro Hasegawa</u>, "Focused ion beam processing to fabricate ohmic contact electrodes on a bismuth nanowire for Hall measurement", *Nanoscale Research Letters*, 2013, 8:400
- Fumiaki Tsunemi, Masayuki Murata, Yusuke Saito, Katsuhito Shirota, <u>Yasuhiro Hasegawa</u>, <u>Takashi Komine</u>, "Shubnikov-de Haas oscillations in individual single-crystal bismuth nanowires encased in quartz template", *Applied Physics Express*, Vol. 6, 045002 (2013)
- Masayuki Murata, Fumiaki Tsunemi, 3. Yusuke Saito, Katsuhito Shirota, Keisuke Fujiwara, Yasuhiro Hasegawa, Takashi Komine, " Dependence of Temperature coefficient electric of resistivity on individual and single-crystal bismuth nanowire", Journal of Electronic Materials, Vol. 42, pp. 2143-2150 (2013)
- <u>Yasuhiro Hasegawa</u>, Masayuki Murata, Fumiaki Tsunemi, Yusuke Saito, Katsuhito Shirota, <u>Takashi Komine</u>, Chris Dames, Javier E. Garay, "Thermal conductivity of an individual bismuth nanowire covered with a quartz template

using a 3-omega technique", Journal of Electronic Materials, Vol. 42, pp. 2048–2055 (2013)

- Masayuki Murata, <u>Yasuhiro Hasegawa</u>, <u>Takashi Komine</u> and Tomohiro Kobayashi, "Preparation of bismuth nanowire encased in quartz template for Hall measurements using focused ion beam processing", *Nanoscale Research Letters*, 2012, 7:505
- Masayuki Murata, Hiroya Yamamoto, Fumiaki Tsunemi, <u>Yasuhiro Hasegawa</u> and <u>Takashi Komine</u>, "Four-Wire Resistance Measurements of a Bismuth Nanowire Encased in a Quartz Template Utilizing Focused Ion Beam Processing", *Journal of Electronic Materials*, Vol. 41, pp. 1442-1449 (2012)

〔学会発表〕(計19件)

- Yasuhiro Hasegawa, Masayuki Murata, Fumiaki Tsunemi, <u>Takashi Komine</u>, Chris Dames, Javier E. Garay, A process for thermal conductivity measurement of an individual bismuth nanowire in quartz template, 31th International Conference on Thermoelectrics・デンマーク・オー ボルー, 2012年7月8~12日
- Masayuki Murata, Fumiaki Tsunemi, 2. Yasuhiro Hasegawa and Takashi Komine, Dependence of temperature coefficient resistivity on of single-crystal individual and bismuth nanowires, 31th International Conference on Thermoelectrics・デンマーク・オー ボルー, 2012年7月8~12日
- Yuta Nabatame, Tsuyoshi Matsumoto, Yuki Ichige, <u>Takashi Komine</u>, Ryuji Sugita, Masayuki Murata, <u>Yasuhiro</u> <u>Hasegawa</u>, Numerical analysis of boundary scattering effect on

transport properties in a Bi-Sb nanowire, 31th International Conference on Thermoelectrics・デ ンマーク・オーボルー, 2012年7月8~ 12日

- 4. Masayuki Murata, Daiki Nakamura, Hiroya Yamamoto, Fumiaki Tsunemi, Yasuhiro Hasegawa, Takashi Komine, Four-wire resistance measurements on bismuth nanowire encased in quartz template utilizing focused ion beam processing, 30th International Conference on Thermoelectrics ・米国・ミシガン州 トラバーシティー、2011年7月17日~ 21日
- 本間亮英,村田正行,寺門宏樹,<u>長谷</u> <u>川靖洋</u>,<u>小峰啓史</u>,熱電対からの熱流 出に伴うゼーベック係数測定の誤差 評価,第61回応用物理学関係連合講 演会・青山学院大学,2014年3月19日
- 寺門宏樹,村田正行,本間亮英,<u>長谷</u> <u>川靖洋</u>,小峰啓史</u>,山嵜正明,寺嶋徹, 引き伸ばし法を用いて作製したBiワ イヤーの熱電特性評価,第61回応用 物理学関係連合講演会・青山学院大学, 2014年3月18日
- 内田仁志,青天目悠太,<u>小峰啓史</u>,青 野友祐,村田正行,<u>長谷川靖洋</u>,Biナ ノワイヤーの結晶方向が輸送特性に 及ぼす影響,第61回応用物理学関係 連合講演会・青山学院大学,2014年3 月18日
- 村田正行,<u>長谷川靖洋</u>,小峰啓史,直 径400 nm級Biナノワイヤーのゼーベッ ク係数とキャリア移動度,第10回日 本熱電学会学術講演会・名古屋大学, 2013年9月8日
- 村田正行,常見文昭,齋藤佑介,代田 雄人,藤原啓資,<u>長谷川靖洋</u>,小峰啓 史,Biナノワイヤー上へのホール測定 用局所電極の作製と評価,第60回応 用物理学関係連合講演会・神奈川工科 大学,2013年3月27日

- 10. <u>長谷川靖洋</u>,常見文昭,村田正行,齋藤佑介,代田雄人,小峰啓史</u>,Dames Chris,石英テンプレート中のBiナノ ワイヤー熱伝導率測定法の開発,第 60回応用物理学関係連合講演会・神奈 川工科大学,2013年3月27日
- 11. <u>長谷川靖洋</u>,石英ガラス封入単結晶 Biナノワイヤ熱電変換素子の開発動 向,ナノワイヤ研究グループ第1回 研究会(応用物理学会ナノワイヤ研究 グループ主催・名古屋大学),2012年 11月9日
- 12. <u>長谷川靖洋</u>,熱電変換の紹介とその 応用について,第16回首都圏北部4 大学新技術説明会,2012年10月12日
- 13. <u>長谷川靖洋</u>,ナノワイヤー熱電変換 素子の開発と動向(熱電ナノテクロノ ジーの最前線),第14回熱・電気エネ ルギー技術シンポジウム((財)熱・ 電気エネルギー技術財団主催・東京イ イノイホール),2012年10月4日
- 村田正行,常見文昭,<u>長谷川靖洋</u>,小 <u>峰啓史</u>,Biナノワイヤー熱電変換素子 の抵抗率の温度依存性,第9回熱電学 会学術講演会・東工大,2012年8月27 日
- 常見文昭,村田正行,<u>長谷川靖洋</u>,小 <u>峰啓史</u>,遠藤彰,Biナノワイヤー熱電 変換素子のShubnikov-de Hass振動測 定,第9回熱電学会学術講演会・東工 大,2012年8月27日
- 村田正行,山本浩也,常見文昭,<u>長谷</u> <u>川靖洋</u>,<u>小峰啓史</u>,石英ガラス中のBi ナノワイヤー上へのホール測定用局 所電極の形成,第59回応用物理学関 係連合講演会・早稲田大学,2012年3 月17日
- 常見文昭,村田正行,<u>長谷川靖洋</u>,<u>小</u> <u>峰啓史</u>,遠藤彰,単結晶ビスマスナノ ワイヤーのShubnikov-de Haas振動, 日本物理学会秋季大会・富山大学, 2011年9月23日
- 平山尚美,遠藤彰,藤田和博,<u>長谷川</u> <u>靖洋</u>,羽田野直道,中村浩章,白崎良 演,米満賢治,ビスマスナノワイヤー

の量子化磁場下での熱電特性の理論 計算,日本物理学会秋季大会・富山大 学,2011年9月23日

 村田 正行、山本 浩也、常見 文昭、
 <u>長谷川 靖洋</u>、小峰 啓史,集束イオン ビーム加工を利用したBiナノワイヤ
 一熱電変換素子の4端子測定,第八
 回日本熱電学会学術講演会・北大, 2011年8月9日

〔産業財産権〕

- 出願状況(計2件)
- 名称:熱電変換素子の電極形成法 発明者:<u>長谷川靖洋</u> 権利者:埼玉大学 種類:特願 番号:2013-019838 出願年月日:平成25年2月4日 国内外の別:国内
- 名称:熱電変換モジュール 発明者:<u>長谷川靖洋</u>,村田正行 権利者:埼玉大学 種類:特願 番号:2013-019839 出願年月日:平成25年2月4日 国内外の別:国内
- 〔その他〕 ホームページ等 http://www.env.gse.saitama-u.ac.jp/hase gawa/
- (1)研究代表者
  長谷川靖洋(HASEGAWA, Yasuhiro)
  埼玉大学・理工学研究科・准教授
  研究者番号:60334158

6.研究組織

(2)研究分担者
 小峰啓史(KOMINE, Takashi)
 茨城大学・工学部・准教授
 研究者番号: 90361287